

Test configurations for diagnosing faulty links in NoC switches

Raik, Jaan; Ubar, Raimund-Johannes; Govind, Vineeth Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli IKTDK teise aastakonverentsi artiklite kogumik : 11.-12. mai 2007, Viinistu kunstimuuseum 2007 / lk. 33-37 : ill

Test configurations for diagnosing faulty links in NoC switches

Raik, Jaan; Ubar, Raimund-Johannes; Govind, Vineeth 12th IEEE European Test Symposium ETS 2007 : 20-24 May 2007, Freiburg, Germany : proceedings 2007 / p. 29-34 : ill <http://dx.doi.org/10.1109/ETS.2007.41>